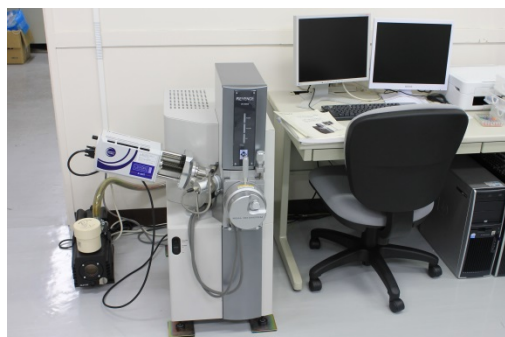


走査型電子顕微鏡 エネルギー分散型X線分析装置

KEYENCE / VE-8800

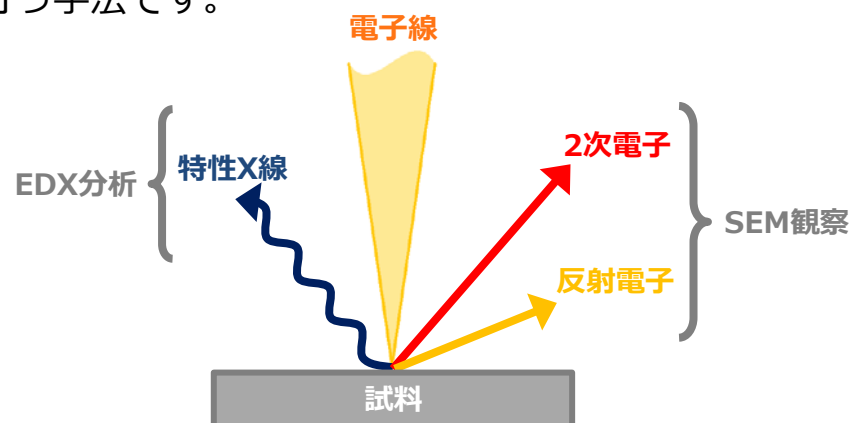
概要



低加速電圧観察対応で、非導電性試料でも非蒸着で観察できます。また電子ビームのエネルギーが低いため、試料最表面の微細な構造まで鮮明に観察できます。付属のEDX検出器でBe~Puの元素分析を行うことができます。元素マッピングを作成することも可能です。

原理

細く絞った電子線を試料表面上に走査して、試料表面から放出される二次電子や反射電子を検出することで、試料を観察します。EDXは二次電子や反射電子と同時に放出される特性X線を利用して元素分析を行う手法です。

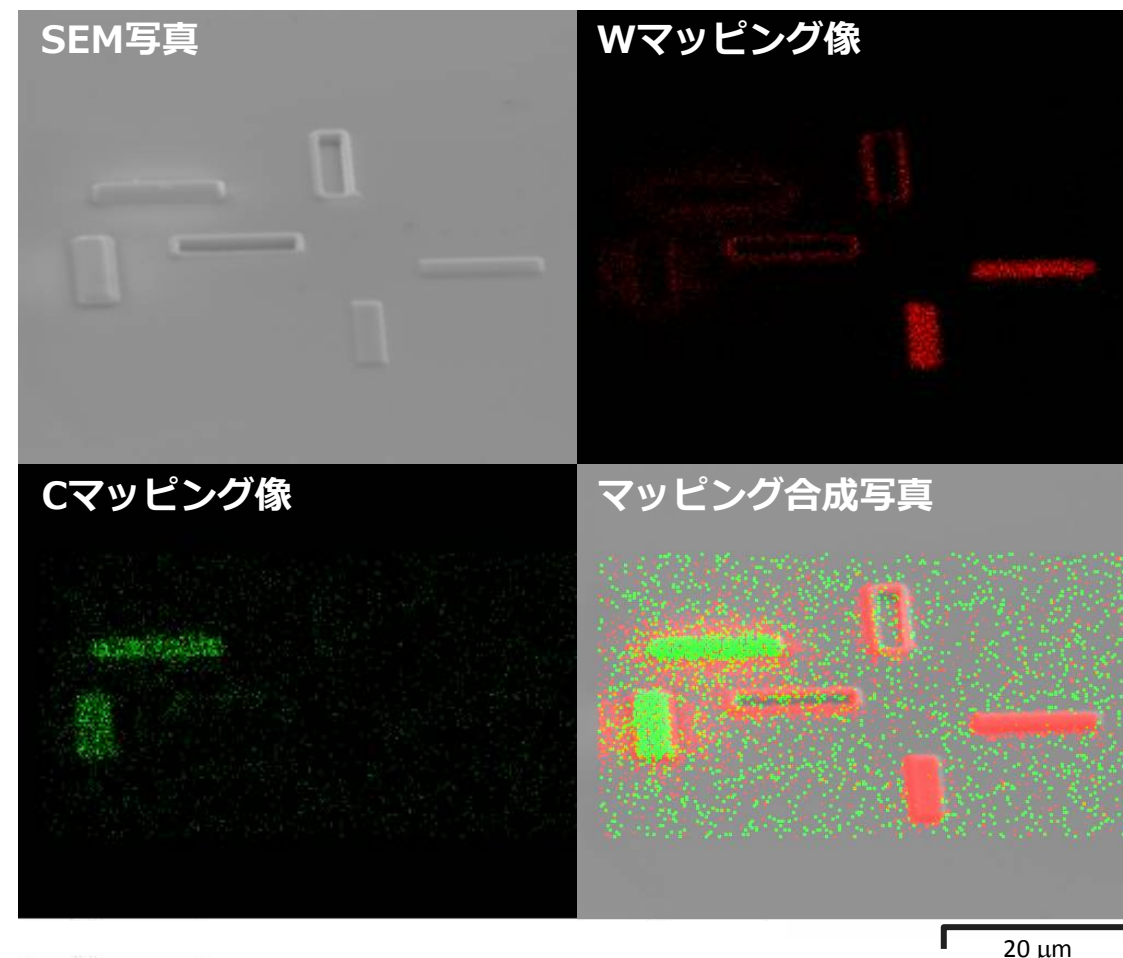


仕様

SEM	倍率	15~100,000倍
	観察範囲	1.3(H) × 1(V) μm~9(H) × 7(V) mm
	分解能	30 nm
	観察象	2次電子像
	加速電圧	0.5kV~20kV
	最大資料サイズ	Φ 64 mm
	試料ステージ	5軸 (X : 32 mm, Y:32 mm, Z : 8~30 mm, 回転 : 360° , 傾斜 : -10~+90°)
EDX	検出可能元素	Be~Pu
	分解能	125eV

分析例

炭素(C)とタングステン(W)を堆積させたSi基板の分析結果



周辺機器

回転式マイクロトーム

Leica BIOSYSTEMS / Leica RM2265



顕微鏡での観察に用いる試料の断面を出したり、極薄の切片を作成するための装置です。

オートファインコーター

JEOL / JEC-3000FC



SEMの試料作製装置として、非導電性試料への白金コーティングを短時間に効率的に行えるイオンスプッター装置です。

ご不明な点等ございましたら、フォトリソセンター技術職員までお問い合わせください。
e-mail : parc-tech@parc.osaoa-u.ac.jp